

X線CTデータの解析（OM型技術支援）

計測分析技術グループ TEL 03-5530-2646

支援内容

都産技研の依頼試験で撮影したX線CTスキャンデータの解析を行います。

CT断層画像の観察では得られない解析情報を入手することができ、データの可視化により視覚的に理解しやすくなります。

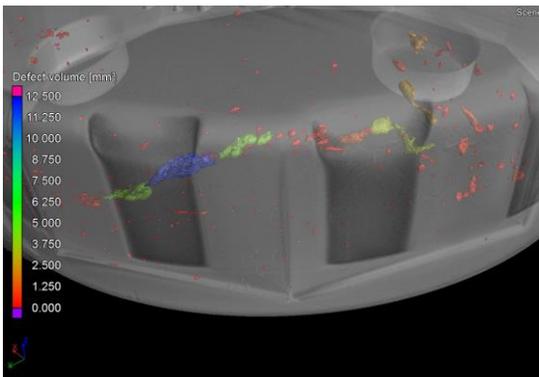
サンプルのポイド（空隙）や異物の調査には、**欠陥/介在物解析**が用いられます。ポイドや異物の体積、個数や他にも様々な数値を求めることができます。ポイドや異物の大きさに応じた色付けが可能のため、断層画像や3D画像から解析結果を観察できます。

ワイヤーや繊維をCTスキャンしたデータによる**繊維配向解析**では、局所的な繊維配向や繊維の長さや直径などの解析を行います。

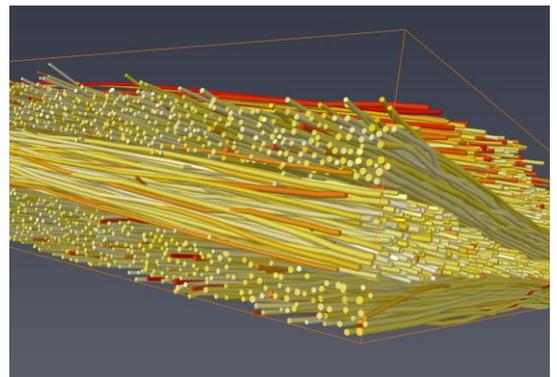
空気と材質の境界面を用いた**寸法測定**や**幾何公差**を求めることが可能です。さらには、CADデータを読み込むことでCADデータとCTスキャンデータとの比較、CTスキャンデータ間での比較ができます。これらの解析に加えて**肉厚解析**では、測定値の差や厚みに応じた色で表示できるため、視覚での認識がしやすくなります。また**STL形式での書き出し**も可能です。

上記以外の解析につきましても、お気軽にご相談ください。

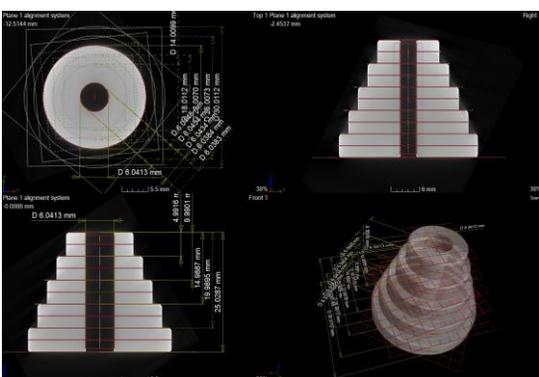
活用例



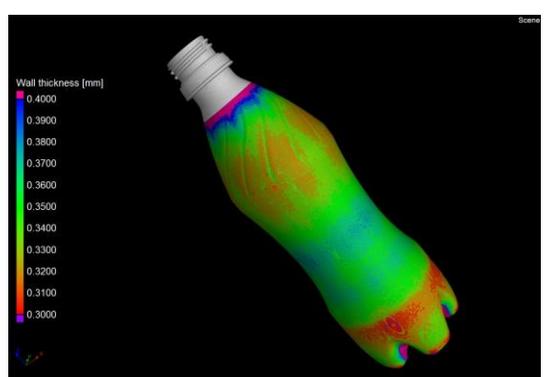
欠陥/介在物解析



繊維配向解析



寸法測定



肉厚解析